

Type: **Metrology M1**

ティルト補正された高アスペクト比のこのメトロロジーチップはインラインプロセスコントロール用自動 AFM システム用に設計されています。

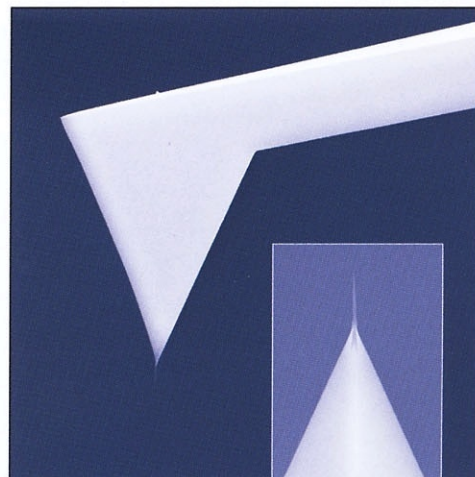
チップは高密度ダイヤモンドライクカ - ボン(High-Dense, Diamond like Carbon)で、殆どの化学物質やドライエッチング剤に対して不活性です。そしてダイヤモンドチップセンサのようにすばらしい耐久性と高分解能を実現しました。

技術仕様

チップ寸法	形状 :	円錐
	長さ :	min. 600 nm
	アスペクト比 :	1:7 以上
	ティルト補正 :	13 °

カンチレバ 厚さ 4 μm 、長さ 125 μm 、幅 30 μm
共振周波数 320 kHz、バネ定数 42 N/m

コーティング 探針側 : なし
反射面側 : なし



探針特性

チップの高信頼性、全チップの 100%検査の他に、実際の速度で急峻なスローブをスキャンするためにスティフネスとフレキシビリティを兼ね備え、さらに1スキャン当りの高速スキャン速度とコストがナノーツツズ社供給のプロブの主要なパラメータです。

このメトロロジーチップ M1 は世界中の半導体業界をリードする製造工場ではエッチングデプスコントロールや STI などの各種 AFM インラインモニタリングで使用されています。



詳細については info@nano-tools.com までお問い合わせ下さい。
nanotools®はナノーツツズ社の登録商標です。

photo © 2005 Veeco Instruments